Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники
Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; **Rätsep, Ülo**; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Качество деионизированной воды, используемой в производстве микросхем
Puusepp, Märt; **Frid, M.**; **Hansen, Eerik**; **Hödrejärv, Helvi** Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1978 / с. 75-76 https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Система контроля микроклимата в производстве интегральных схем
Hansen, Eerik; **Puusepp, Märt** Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1971 / с. 88-92
https://www.ester.ee/record=b1802011*est